25.07.2017Udział w konferencji CNM2017 „5th conference on nano and micromechanics”

Autor : Dariusz Czułek
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 4-6 lipca 2017 r. pracownicy Głównego Urzędu Miar wzięli udział w międzynarodowej konferencji CNM2017 „5th conference on nano and micromechanics” organizowanej przez prof. dr hab. inż. Teodora Gotszalka z Politechniki Wrocławskiej.

Przedstawicielami GUM na konferencji byli Zbigniew Ramotowski, Dariusz Czułek, Bartosz Misztal oraz Łukasz Ślusarski. Podczas konferencji wygłoszono kilkadziesiąt referatów dotyczących nanometrologii wykorzystywanej w wielu dziedzinach pomiarowych, np.: długości, elektryczności, sile, temperaturze. Przedstawiciele GUM wraz z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Technologii Elektronowej zaprezentowali plakat „Electromagnetically actuated microbridges for nanometrology application". Zaprezentowane na konferencji wstępne wyniki badań dotyczą prac prowadzonych ściśle w ramach grupy roboczej WG4 „Nanotechnologie" Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. infrastruktury i zastosowań specjalnych. Badania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskiego przemysłu w zakresie nanometrologii wymiarowej.